

Программа «Элементы математической кибернетики»

1. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы (ДНФ и КНФ). Допустимые и минимальные конъюнкции. Тупиковые, минимальные, кратчайшие и сокращенные ДНФ. Геометрическая интерпретация: n -мерный двоичный куб, допустимые и максимальные интервалы, покрытие максимальными интервалами, тупиковые, кратчайшие и минимальные покрытия.
2. Метод Порецкого-Блейка построения сокращенной ДНФ. Сокращенная ДНФ монотонной функции.
3. Критерий поглощения конъюнкции ДНФ. Алгоритм Яблонского построения всех тупиковых ДНФ. Градиентный алгоритм построения ДНФ, близких к кратчайшим.
4. Окрестности ранга r . Локальные алгоритмы. Ядро ДНФ. Алгоритм Куайна проверки принадлежности конъюнкции ДНФ $\cap T$.
5. Критерий вхождения ДНФ в ДНФ $D_{\cup T}$.
6. Цепные и циклические функции. Теорема Журавлева об отсутствии локального критерия вхождения конъюнкции в ДНФ $D_{\cup M}$.
7. Максимальная длина кратчайшей ДНФ и максимальная сложность минимальной ДНФ у функций n переменных.
8. Верхние и нижние оценки максимальной длины сокращенной ДНФ.
9. Пример функции n переменных с числом кратчайших ДНФ, большим 2^{2^n} .
10. Пример функции n переменных, у которой число тупиковых ДНФ в сверхэкспоненциальное число раз больше, чем число кратчайших ДНФ.
11. Контактные схемы. Простейшие методы синтеза. Контактное дерево. Свойство разделительности.
12. Доказательство минимальности контактного дерева в классе разделительных схем.
13. Реализации всех конъюнкций контактной схемы со сложностью $2^n(1 + o(1))$. Свойство ослабленной разделительности.
14. Нижняя оценка функции Шеннона сложности реализации булевых функций n переменных схемами в базисе $\{\&, \vee, \neg\}$. Нижняя оценка функции Шеннона сложности реализации булевых функций n переменных контактными схемами.
15. Метод каскадов для контактных схем и схем из функциональных элементов.
16. Вывод верхней оценки Шеннона сложности реализации функций n переменных контактными схемами и схемами из функциональных элементов путем применения метода каскадов.

17. Последовательно-параллельные контактные схемы и их связь с формулами в базисе $\{\wedge, \vee, \neg\}$. Метод Храпченко получения нижних оценок сложности реализации формулами в базисе $\{\wedge, \vee, \neg\}$ индивидуальных булевых функций. Квадратичная оценка сложности формульной реализации линейной функции.

18. Асимптотически оптимальный метод Лупанова построения схем в базисе $\{\wedge, \vee, \neg\}$.

19. Асимптотически наилучший метод синтеза контактных схем.

20. Самокорректирующиеся контактные схемы. Корректировка одного замыкания/размыкания.

21. Таблицы неисправностей и тесты. Минимальные и тупиковые тесты. Алгоритм построения всех тупиковых тестов.

22. Верхние и нижние оценки длины минимального теста. Достигимость этих оценок.

23. Диагностические и проверяющие тесты. Единичные тесты для константных неисправностей. Верхняя оценка длины единичного диагностического теста для асимптотически оптимальных схем.

24. Градиентный метод построения покрытия и оценка его длины. Пример плохой работы градиентного алгоритма.

25. Метод Редди построения легкотестируемых схем в базисе $\{\wedge, \oplus, 1\}$.

26. Метод Пиппенджера построения схем оптимальной по порядку сложности из ненадежных функциональных элементов.

27. Метод Мура-Шеннона построения надежных контактных схем из ненадежных контактов.

28. Оценки мощности максимального кода с данным минимальным расстоянием. Асимптотически оптимальный метод синтеза схем из функциональных элементов со свойством самокоррекции слаборастущего числа произвольных неисправностей.

29. Эквивалентные преобразования контактных схем. Полная система правил для схем с n переменными.

30. Отсутствие полной конечной системы правил преобразования для произвольных контактных схем.